

25 мая 2022 г.

г. Санкт-Петербург
Площадь Александра Невского, д. 2 | Гостиница «Москва» | этаж 2

**Новейшие разработки в области аналитического оборудования
для исследования и контроля качества материалов.
Обзор оборудования из несанкционных стран.**

Начало	Наименование доклада	Место проведения
09:30-10:00	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.	
Конференц – зал "Кремлевский"		
10:00-10:30	Приветственное слово.	Протасова Ирина Николаевна
Конференц – зал «Ленинградский + Невский»		
10:30-17:00	Новинки оборудования и методик в области химического и структурного анализа материалов. Промышленная томография. Обзор оборудования из несанкционных стран.	Лебедев Дмитрий Сергеевич Ахметов Марат Фанильевич Железный Марк Владимирович
Конференц – зал «Тверской + Ямской»		
10:30-17:00	Новинки оборудования и методик в области физико-механических испытаний материалов, материалогRAFических методов исследования материалов. Обзор оборудования из несанкционных стран.	Протасова Ирина Николаевна Мурашов Александр Александрович Хаханов Сергей Николаевич Сивкова Татьяна Александровна (SIAMS)
17:00	Завершение семинара. Фуршет.	


25 мая 2022 г.
г. Санкт-Петербург
 Площадь Александра Невского, д. 2 | Гостиница «Москва» |
 Конференц – зал «Ленинградский + Невский», этаж 2

**Новинки оборудования и методик в области
химического и структурного анализа материалов.
Промышленная томография.**

Конференц – зал «Ленинградский + Невский»

Начало	Наименование доклада	Докладчик
10:30	Решения для анализа металлов и сплавов - стационарные и мобильные оптико-эмиссионные спектрометры. Анализ нетиповых образцов. Оборудование для пробоподготовки.	Лебедев Дмитрий Сергеевич
11:00	Особенности эксплуатации анализаторов лёгких элементов. Важность использования CS/ONH анализаторов при аддитивном производстве. Расходные материалы.	Лебедев Дмитрий Сергеевич
11:30	Перерыв. Кофе-брейк.	
11:45	Новые возможности портативных РФА спектрометров для решения задач различных отраслей промышленности. Особенности применения портативных РФА анализаторов для задач исследования объектов культурного наследия.	Лебедев Дмитрий Сергеевич
12:25	Обзор решений молекулярной спектроскопии для контроля технологических процессов при производстве электронных и оптических компонентов, а также примеры решения иных задач.	Ахметов Марат Фанильевич
13:00	Обед	
14:00	Исследовательские возможности промышленных рентгенофлуоресцентных анализаторов. Особенности пробоподготовки различных образцов.	Железный Марк Владимирович
14:30	Применение макро- и микрорентгеновских спектрометров для анализа толщины покрытий и скрининга на соответствие ТР ЕАЭС 037/2016 (ROHS). Новые возможности элементного картирования.	Железный Марк Владимирович
14:50	Обзор оборудования для фазового и структурного анализа. Модельный ряд и примеры решения различных задач.	Железный Марк Владимирович
15:15	Перерыв. Кофе-брейк.	
15:30	Новые спектрометры ИСП-ОЭС и ИСП-МС серии Plasma Quant Analytik Jena (Германия) для элементного и изотопного анализа.	Ахметов Марат Фанильевич
16:15	Оборудование для радиографии и компьютерной томографии от компании «Sanying» (Китай). Применение для контроля качества в различных отраслях промышленности.	Лебедев Дмитрий Сергеевич
17:00	Завершение семинара. Фуршет.	
	Мастер-класс: «Практическое применение. Индивидуальная работа с Вашими образцами» (в течение дня, по предварительной записи).	Антонов Никита Георгиевич



25 мая 2022 г.

г. Санкт-Петербург
Площадь Александра Невского, д. 2 | Гостиница «Москва» |
Конференц – зал «Тверской + Ямской», этаж 2

**Новинки оборудования и методик в области
физико-механических испытаний материалов,
материалографических методов исследования материалов.**

Конференц – зал «Тверской + Ямской»

Начало	Наименование доклада	Докладчик
10:30	Испытательная техника Walter + Bai (Швейцария). Современные системы для испытаний на длительную прочность/ползучесть. Двух- и трех- зонные электромеханические испытательные машины.	Протасова Ирина Николаевна
11:30	Перерыв. Кофе-брейк.	
11:45	Усталостные испытания на резонансных пульсаторах Rumul (Швейцария) с возможностью работы в режиме статического нагружения для испытаний по определению K1C. Высокочастотный пульсатор Gigaforte-50.	Протасова Ирина Николаевна
12:30	Твердомеры Emco-Test (Австрия). Цветная обзорная камера в моделях DuraScan 70/80 и DuraVision 250/350. Программные модули gearMaster, linePlus, Fracture. Твердомеры компании Sinowon (Китай).	Мурашов Александр Александрович
13:00	Обед.	
14:00	Оборудование для пробоподготовки Struers (Дания). Решение любых задач: модульные настольные шлифовально-полировальные станки серии LaboSystem. Новый ручной отрезной станок Labotom-20. Оборудование для пробоподготовки TROJAN (Китай).	Мурашов Александр Александрович
14: 35	Оптические микроскопы Sunny Optical (Китай): обзор модельного ряда. Прямой исследовательский микроскоп RX50, металлографический инвертированный микроскоп ICX41M, стереомикроскоп SZX12.	Мурашов Александр Александрович
15:15	Перерыв. Кофе-брейк.	
15:30	Автоматизированные методы анализа микроструктуры материалов SIAMS.	Сивкова Татьяна Александровна (SIAMS)
15:50	Применения электронных микроскопов Thermo Fisher Scientific (США) для решения металлографических задач в условиях заводских лабораторий: сканирующий электронный микроскоп Axia ChemiSEM.	Хаханов Сергей Николаевич
16:30	Быстрое и точное определение неметаллических включений с помощью настольных электронных микроскопов Thermo Fisher Scientific (США). Новое поколение настольных СЭМ Phenom: Pure G6, ProX G6, XL G2. Настольный электронный микроскоп ZEM15, Zeptools (Китай).	Мурашов Александр Александрович
16:50	Комплексные решения для определения механических свойств поверхностей компании Nanovea (США).	Мурашов Александр Александрович
17:00	Завершение семинара. Фуршет.	
	Мастер-класс: «Практическое применение. Индивидуальная работа с Вашими образцами» (в течение дня, по предварительной записи).	Специалист компании SIAMS



25 мая 2022 г.

г. Санкт-Петербург
Площадь Александра Невского, д. 2 | Гостиница «Москва» | этаж
2

Оборудование для проведения мастер-класса:

Мобильный оптико-эмиссионный спектрометр Ferro.lyte, Elementar (Германия)

Инвертированный микроскоп GX53, Olympus (Япония)

Оптико-эмиссионный спектрометр Q2 Ion, Bruker (Германия)

Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр S1 Titan, Bruker (Германия)

**Участие в мастер-классе по предварительной записи при регистрации.
Рекомендованное количество образцов для анализа не более 2-х.**

Если у вас есть вопросы или пожелания к содержанию семинара, докладчикам,
просим обращаться к Бебякиной Марине по телефону: **+7 (812) 380-34-35** или по e-mail: infospb@melytec.ru